

1. Record Nr.	UNISA996216501203316
Titolo	2010 28th VLSI Test Symposium
Pubbl/distr/stampa	[Place of publication not identified], : IEEE, 2010
ISBN	1-4244-6650-4
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph